

課題番号 : F-15-BA-43
利用形態 : 技術代行
利用課題名(日本語) : FIB 実践セミナーの一環としての操作実習
Program Title (English) : FIB training with lecture
利用者名(日本語) : 守田佳世
Username (English) : K. Morita
所属名(日本語) : 株式会社東芝
Affiliation (English) : Toshiba Corporation

1. 概要(Summary)

TEM 観察サンプル作成のための FIB 操作トレーニングを行う。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

FIB-SEM(FEI, Helios NanoLab 600i)

【実験方法】

FEI 社製 Helios NanoLab 600i を使用し、試料導入、保護膜堆積、粗加工、断面クリーニング、高分解能観察(SEM)の操作トレーニングを受講した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

短期間で FIB 操作を習得する事が出来た。

4. その他・特記事項(Others)

なし。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

6. 関連特許(Patent)

なし。